

หัวข้อการวิจัย การศึกษาการวัดความหนาของพิล์มบางโดยวิธีอินเตอร์เฟียโรเมตร์  
การวิจัย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนฟิสิกส์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524  
ชื่อผู้ทํา ชีรวัฒน์ ภูข่าวัญเมือง

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นการศึกษาการวัดความหนาของพิล์มบาง โดยอาศัยผลจากการทดลองของแสง การทดลองทำได้โดยการนำพิล์มบางที่มีลักษณะเป็นชั้นไปเห็นกระจากข้างในของอินเตอร์เฟียโรเมตร์แบบ Michelson และใช้แสงโซเดียม แสงเม็ดวิวี และแสง He-Ne laser เป็นต้นกำเนิดแสง บันทึกรูปแบบของการแทรกสอดลงบนพิล์มถ่ายรูป วัดระยะบนพิล์มโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับวัดระยะทางที่เลื่อนได้จากการเขียนกราฟระหว่างลำดับของ fringe กับระยะบนพิล์มที่เกิดการแทรกสอดสูงสุด หรือการแทรกสอดต่ำสุด ทำให้สามารถหาค่าระยะที่ fringes เลื่อนไป ( $\Delta m$ ) ซึ่งสามารถนำไปคำนวณความหนาของพิล์มบางได้ ในกรณีที่รังสีได้ทำการวัดความหนาของพิล์มบาง 7 ตัวอย่าง พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดประมาณ 7.85% ทั้งนี้คาดว่าสาเหตุ เพราะพิล์มตัวอย่างไม่มีความเรียบเที่ยงสำหรับการวัด

Title      Interferometry Technique in Measurement of Thin Film Thickness

Research    Master of Science (Teaching Physics)  
              Chiang Mai University, 1981

Name       Therawatana Bhukhvamuang

#### Abstract

The purpose of this project is to study on the thin-film thickness measurement by using interferometry technique. In carrying out the experiment, one arm of the Michelson interferometer is replaced by a step thin-film sample. A sodium lamp, a mercury lamp and a He-Ne laser are used as the light sources. Interference patterns are photographed by using an ordinary photographic camera. The distance between minima and maxima interference on the photographic film can be measured by using a travelling microscope. The relationship between the fringe numbers and the positions of the maxima or minima fringes can be obtained from the graph. The fractional order ( $\Delta m$ ) can be found to give the thickness of the thin film. Seven different samples are used in this experiment. It is found that the maximum error is about 7.85% due to the non-uniform thickness of the thin film.

Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved